



Сканирующий электронный микроскоп

Получение изображения поверхности объекта с высоким разрешением, а также информации о химическом составе поверхностного слоя

Сканирующий электронный микроскоп позволяет получать изображения поверхности объекта с высоким разрешением. Высокая разрешающая способность обеспечивается за счет использования сфокусированного потока электронов для построения изображения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Биология
- Медицина
- Геология
- Материаловедение
- Промышленность
- Криминалистика

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкая цена в сравнении с иностранными аналогами
- Первая отечественная разработка сканирующего микроскопа

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ

Разработан макет устройства

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ускоряющее напряжение – 15 кВ
- Разрешение – до 1 мкм
- Степень увеличения: до 1000x
- Система детектирования: BSE-детектор, SE-детектор
- Вакуумная система: полностью автоматическая вакуумная система
- Вес устройства: не более 150 кг
- Габариты устройства: не более 700x500x800 мм



Макет электронного сканирующего микроскопа

ПРАВОВАЯ ОХРАНА

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024684967

«Программа управления макетом сканирующего электронного микроскопа («EMControl»)»

Больше научно-технических разработок на сайте ctt.etu.ru

Контакты Центра трансфера технологий СПбГЭТУ «ЛЭТИ»: +7 (812) 234-24-84, ctt@etu.ru